На правах рукописи

Jungo -

ТАРАСОВ Дмитрий Геннадьевич

РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ФТОРОПЛАСТОВОГО КОМПОЗИТА К ИОНИЗИРУЮЩЕМУ ИЗЛУЧЕНИЮ В УСЛОВИЯХ МАГНИТОСФЕРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

Специальность 01.04.07 - «Физика конденсированного состояния»

ΑΒΤΟΡΕΦΕΡΑΤ

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ –	доктор технических наук, профессор, Заслуженный изобретатель РФ, Белгород- ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, директор ИСМиТБ
	ИСМИТЬ
	Павленко Вячеслав Иванович

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ – Внуков Игорь Евгеньевич, доктор физико-математических наук, профессор, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, заведующий кафедрой общей и прикладной физики

Бакалин Юрий Иванович,

доктор технических наук, профессор, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, профессор кафедры физики

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт перспективных материалов и технологий», г. Москва

Защита состоится «<u>8</u>» <u>февраля</u> 2013 г. в «<u>14⁰⁰</u>» на заседании диссертационного совета Д 212.015.04 при ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».

Автореферат разослан «<u>21</u>» <u>декабря</u> 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, канд. физ.-мат. наук

A

В.А. Беленко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Федеральной космической программой России на 2006-2015 годы предусмотрен ряд задач, одной из которых является обеспечение стойкости бортовой радиоэлектронной аппаратуры в течение 10-15 лет.

При функционировании космических аппаратов (КА) в радиационных поясах Земли, в частности на геостационарной орбите (ГСО), материалы, расположенные на внешней поверхности, подвергаются воздействию потоков быстрых электронов и протонов с широким энергетическим спектром. Термализуясь в диэлектрических материалах, эти частицы способны создавать внедренный нескомпенсированный электрический заряд, способный заметным образом изменять электрофизические свойства диэлектриков, а также вызывать различного рода обратимые и необратимые эффекты, приводящие к нарушению нормального функционирования бортовых систем КА [1,2].

В период магнитосферных возмущений на ГСО возникают электроразрядные аномалии в работе за счет внедренного объемного заряда и спонтанных разрядов диэлектрических элементов аппарата под действием быстрых электронов с энергией более 1МэВ [1-3]. Спонтанные импульсные разряды создают широкий спектр электромагнитных помех (ЭМП) в электрических цепях и в электронном оборудовании в интервале 10⁻¹–10³ МГц [2].

С целью снижения интенсивности ЭМП от разрядных явлений в объеме диэлектрических элементов оборудования необходимо иметь радиационную защиту ключевых электронных узлов, способную снизить поток электронов с энергией выше 1 МэВ [1].

Создание новых видов высокоэффективных полимерных композитов (ПК), обладающих (наряду с диэлектрическими) свойствами радиационной защиты, имеет важное значение и обуславливает необходимость совершенствования теории и практики их проектирования.

Материалы с высоким уровнем электретности (способностью эффективно удерживать внедренный электрический заряд) могут быть получены на основе технологии синтеза высоконаполненных радиационно-защитных ПК с внедренными полупроводниковыми областями, что значительно увеличит электрическую емкость диэлектрика под действием космического облучения.

Диссертационная работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы ГК № 14.740.11.0054 «Диэлектрические композиционные материалы на основе высо-конаполненной фторопластовой матрицы для комплексной защиты электронно-го оборудования от космических излучений и микрометеоритных частиц».

Цель исследования. Разработка композиционного материала на основе высоконаполненной фторопластовой матрицы и исследование его радиационной стойкости к ионизирующему излучению геостационарной орбиты в условиях магнитосферных возмущений.

Для достижения цели в работе решались следующие задачи:

 - разработка состава и технологии получения композиционного материала на основе фторопластовой матрицы и модифицированного кремнийорганическим олигомером оксида висмута, γ-модифицирование композита и исследование его свойств;

- моделирование процессов воздействия электронного (1-5 МэВ), протонного (1-5 МэВ) и γ-облучения (0,05-1,25 МэВ) на композит;

 имитационное воздействие факторов космического пространства (быстрых электронов и протонов) на композит и исследование его объемной электризации при радиационном заряжении;

- исследование механизма защиты от электронного облучения за счет формирования в объеме диэлектрика полупроводниковых областей;

 экспериментальные исследования радиационно-защитных характеристик и радиационной стойкости.

Научная новизна работы.

Выявлен механизм γ-модифицирования высоконаполненного композита на основе фторопластовой матрицы и модифицированного кремнийорганическим олигомером оксида висмута, преимущественно протекающий за счет образования парамагнитных центров на атомах кремния Si•-типа в наполнителе и пероксидных CFO₂•-типа макрорадикалов в полимерной матрице.

Установлено, что за счет имеющихся в структуре полупроводниковых областей результатом электрического пробоя радиационно-заряженного полимерного композита для образцов, облученных потоками быстрых электронов (E_e =5 МэВ), становится образование развитой сети объемных разрядных каналов, а при воздействии протонов (E_p =4,2 МэВ) возникает единичный разрядный канал.

Выявлен механизм защиты от электронного облучения за счет формирования в объеме диэлектрика полупроводниковых областей, заключающийся в перераспределении накопленного объемного заряда, что увеличивает общую емкость композита и время до электрического пробоя с формированием разрядных каналов, разрядный ток в которых имеет практически равные величины.

Практическая значимость.

Разработана технология получения композита на основе фторопластовой матрицы и модифицированного оксида висмута с достижением более высокой степени наполнения при максимальном повышении прочностных характеристик композита по сравнению с известными аналогами.

С помощью физико-математического моделирования с использованием пакетов программ, основанных на имитационном методе Монте-Карло, рассчитаны коэффициенты поглощения и отражения электронного пучка (E_e =1-5 МэВ), коэффициент усиления дозы для протонного пучка (E_p =1-5 МэВ), факторы накопления, коэффициенты пропускания, поглощения и альбедо γ -излучения (E_{γ} =0,05-1,25 МэВ).

Разработаны ТУ на композиционный материал для защиты от космической радиации ПК-МОВ-60, обладающий высокой радиационной стойкостью и комплексно снижающий радиационное воздействие в условиях геостационарной орбиты в сравнении с существующими материалами. Выявлена возможность нанесения на композит токопроводящего латунного покрытия методом магнетронного напыления.

Полученный полимерный композит способен значительно увеличить срок пребывания в космическом пространстве за счет снижения уровня ЭМП от разрядных явлений, может быть перспективным в области космического материаловедения и позволит расширить номенклатуру радиационно-защитных полимерных композитов.

Результаты диссертационной работы использованы в учебном процессе при подготовке специалистов по профилю (280700.62-08) «Радиационная и электромагнитная безопасность» в рамках направления (280700.62) «Техно-сферная безопасность».

Положения, выносимые на защиту:

 определение оптимального состава, технологии получения и механизма γ-модифицирования высоконаполненного композита на основе фторопластовой матрицы и модифицированного кремнийорганическим олигомером оксида висмута;

- анализ результатов моделирования прохождения быстрых электронов, протонов и γ-излучения через полимерный композит;

- влияние сформированных полупроводниковых областей на развитие электрического разряда и механизм защиты от электронного облучения;

- анализ радиационно-защитных характеристик и радиационной стойкости композита.

Личный вклад автора.

Результаты, представленные в диссертации, получены лично автором или при его непосредственном участии. При выполнении диссертационной работы автор принимал участие в постановке задач, выполнении экспериментов и анализе полученных экспериментальных результатов.

Апробация результатов работы.

Основные результаты работы доложены: на Всероссийской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов «Актуальные проблемы авиации и космонавтики» (Красноярск, 2010 г.); на XXX, XXXI Российских школах по проблемам науки и технологий (Миасс, 2010, 2011 гг.); на 2-ой Всероссийской школе-семинаре студентов, аспирантов и молодых ученых по тематическому направлению деятельности национальной нанотехнологической сети «Функциональные наноматериалы для космической техники» (Москва, 2011 г.); на III Международной научно-инновационной молодежной конференции «Современные твердофазные технологии: теория, практика и инновационный менеджмент» (Тамбов, 2011 г.); на XXII Международной конференции «Радиационная физика твердого тела» (Севастополь, 2012 г.).

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том числе 3 в рецензируемых научных журналах и изданий, рекомендованных ВАК, 1 заявка на патент.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, общих выводов, списка литературы из 165 наименований и 3 приложений. Работа изложена на 133 стр. машинописного текста, включающего 55 рис. и 13 табл.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** показана актуальность диссертационной работы, сформулированы цель и задачи исследования, отмечена научная новизна полученных результатов и практическая значимость работы.

В первой главе проведен анализ радиационных условий космического пространства, рассмотрены процессы электризации диэлектрических материалов космических аппаратов и элементов конструкции, а также возникновения электростатических разрядов. Осуществлен поиск имеющихся полимерных материалов в области радиационного и космического материаловедения, рассмотрено влияние радиационного воздействия на охрупчивание фторопласта и композиты на его основе.

Во второй главе приведены описание методов и характеристики применяемых материалов для исследования.

В качестве матрицы использован фторопласт-4 (политетрафторэтилен) ГОСТ 10007-80, а в качестве наполнителя - оксид висмута (α -Bi₂O₃) ГОСТ 10216-75 с размером большей доли частиц 0,5-2 мкм, являющийся полупроводником р-типа.

Для модификации поверхности оксида висмута использован олигомер полиалкилгидросилоксан «Пента-808-А» ТУ 2229-263-40245042-2010.

Облучение ПК в пучке быстрых электронов выполнены на линейных электронных ускорителях с энергией пучка в испытаниях до 5 МэВ и на установке для имитирующих испытаний диэлектрических полимерных композитов электронным излучением с энергией 30 кэВ. Источником протонов являлся циклотрон с энергией пучка в испытаниях до 4,2 МэВ. Воздействие у-излучением производили на установке РХМ-γ-20 с источником ⁶⁰Со-мощностью 0,1-10 Гр/с.

Исследование радиационно-защитных свойств материалов по отношению к γ -излучению проведены на базе γ -источников типа 137 Cs, 60 Co.

Напыление токопроводящего покрытия проводили в вакуумной установке, оснащенной несбалансированной магнетронной распылительной системой. В качестве токопроводящего покрытия выбрана латунь, которая характеризуется высокой адгезией к высоконаполненной полимерной подложке и низким удельным сопротивлением. Для моделирования прохождения электронного, протонного и γизлучения через композиты были использованы пакеты программ, реализация которых основана на имитационном методе Монте-Карло.

В третьей главе приведены результаты исследований по модифицированию поверхности оксида висмута, разработаны состав и технология изготовления высоконаполненного композита, изучены его физико-технические характеристики, а также рассмотрена возможность модифицирования ПК под действием γ-излучения ⁶⁰Со (E=1,25 МэВ).

Синтез высокодисперсного наполнителя на основе оксида висмута. Осуществлена предварительная подготовка поверхности оксида висмута путем его мокрого помола в водной среде, кипячения, обработки ультразвуком (22 кГц) и последующей сушки продукта при 120°С в кипящем слое с целью образования на поверхности частиц активных гидроксильных ОН-групп.

Гидроксилирование поверхности порошка оксида висмута протекает по схеме:

$$Bi_{2}O_{3}+H_{2}O \rightarrow 2 \begin{bmatrix} -O \\ Bi - \\ -O \end{bmatrix}^{+} -OH^{-}$$
(1)

Гидроксилированный сухой оксид висмута по разработанной методике модифицировали кремнийорганическим олигомером по схеме:

Технология получения композита на основе фторопласта. Технология изготовления разрабатываемого композита включала следующие стадии: смешение в смесителе порошкообразного фторопласта и наполнителя модифицированного оксида висмута (МОВ); механоактивация в струйной вихревой мельнице; горячее прессование подготовленной смеси; спекание полученных образцов; у-модифицирование спеченных композитов.

По результатам зондовой микроскопии при использовании в качестве наполнителя МОВ в сравнении с немодифицированным наполнителем на профилограмме поверхности ПК наблюдается снижение частоты и амплитуды колебаний по ходу зонда на границе раздела «матрица-наполнитель» по всей области сканирования.

Сравнение результатов статистических данных поверхности ПК с немодифицированным оксидом висмута и данных для ПК с наполнителем МОВ показывает снижение значений параметров шероховатости поверхности (S_z от 948,044 нм до 809,143 нм, S_a от 254,77 нм до 135,311 нм, S_q от 299,185 нм до 175,033 нм) при более низких значениях перепадов поверхностей (S_{max} от 1940,89 нм до 1427,13нм). Это указывает на более интенсивное взаимодействие модифицированных высокодисперсных частиц оксида висмута с расплавом фторопласта, приводящее к большей однородности ПК в целом.

С увеличением содержания наполнителя вклад давления прессования становится более заметным. Так, для состава, содержащего 50 мас.% МОВ, плотность в интервале удельного давления прессования от 400 до 1400 МПа изменяется на 2,3%, причем, начиная с давления ≈700 МПа, изменения не наблюдаются, а для состава с содержанием 80 мас.% наполнителя прирост плотности составляет уже 16,0%.

Использование модифицированного наполнителя МОВ позволило увеличить степень наполнения ПК на 15-20% по сравнению с немодифицированным оксидом висмута при одинаковой прочности ПК.

УЗ-методом установлена оптимальная степень наполнения фторопластовой матрицы МОВ (60 мас.%; МОВ-60), что на 10 мас.%. превосходит результаты, полученные при использовании известного метода порошковой металлургии. Оптимальная степень уплотнения для ПК (МОВ-60) достигается при давлении прессования P_{va}=1200 МПа.

Радиационное модифицирование разрабатываемого композита. Применение радиационного модифицирования позволило значительно увеличить прочностные характеристики как за счет радиационной закалки самого фторопласта, так и сшивки матрицы с наполнителем.

Методом ЭПР выявлено образование радикалов, наибольший интерес из которых представляют парамагнитные центры на атомах кремния \equiv Si[•], основным источником которых является хемосорбированный на оксиде висмута полиалкилгидросилоксан, и пероксидные радикалы ~CFO₂[•] и ~CF₂-CFO₂[•]-CF₂~.

Содержание макрорадикалов заметно увеличивается при интегральной дозе выше 20 кГр для ПК (МОВ-60), достигая максимума при 80 кГр, а в дальнейшем резко снижается (рис. 1). В зависимости от интегральной дозы меняется



Рис. 1. Зависимость концентрации радикалов в ПК-МОВ-60 от поглощенной дозы (\dot{D} ==1 Гр/с) для источника ⁶⁰Со

и характер накопления радикалов. Так, для ПК до поглощенной дозы D = 80 кГр отношение доли Siрадикалов к CFO₂•-радикалам составляет Si•/CFO₂•= 1,40. При D > 80 кГр наблюдается снижение концентрации Si• - радикалов, а также уменьшение скорости накопления CFO₂•-радикалов.

При интегральных дозах 100-200 кГр устанавливается стационарное значение концентраций рассматриваемых типов радикальных частиц.

Увеличение мощности дозы от 1 до 8 Гр/с сопровождается снижением дозы максимальной концентрации макрорадикалов (Si• + CFO₂•) - типа от 80 до 40 кГр. С увеличением мощности дозы (\dot{D} ==10 Гр/с) происходит уменьшение разности между максимальным и стационарным значениями концентрации радикалов.

При увеличении толщины слоя ПК концентрация макрорадикалов снижается, что вызвано недостаточной скоростью диффузии кислорода в глубинные слои материала и интенсивным поглощением ү-излучения.

Механизм радиационной γ-сшивки фторопласта с наполнителем – модифицированным оксидом висмута представлен рекомбинационными реакциями радикального типа по схемам, в которых учтена возможность взаимодействия наполнителя с фторалкильными радикалами матрицы:



Свойства высоконаполненного композита разработанного состава. Проведенные исследования показывают высокие значения физикомеханических свойств и диэлектрических характеристик разработанного композита, а также стойкость материала к выдержке в широком температурном интервале от -150 до 130 °C (табл. 1).

Таблица 1

Показатель	Параметр ПК
Плотность, кг/м ³	4420
Прочность при растяжении, МПа	10,9
Прочность при изгибе, МПа: -150 °С	17,43
20 °C	17,5
130 °C	17,5
Модуль упругости при растяжении, МПа	2170
Модуль упругости при изгибе, МПа	3240
Модуль упругости при сжатии, МПа	3630
Деформация при сжатии под нагрузкой 14 МПа за 24 ч, %	0,9
Остаточная деформация через 24 ч после снятия нагрузки 14	0,02
МПа, %	
Твердость по Бринеллю, МПа	66
Ударная вязкость, кДж/м ²	198
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом см	$7 \cdot 10^{11}$
Относительная диэлектрическая проницаемость	3,8

Физико-механические и диэлектрические свойства ПК (МОВ-60)

В четвертой главе представлены результаты моделирования процессов взаимодействия ПК (МОВ-60) с электронами (E_e =1-5 МэВ), протонами (E_p =1-5 МэВ) и γ-излучением (E_{γ} =0,05-1,25 МэВ).

Моделирование процессов прохождения электронов в полимерном композите. Наблюдается экстремальный характер распределения поглощенной дозы по толщине образца (рис. 2). Для пучка электронов с E_e=2-5 МэВ полоса максимума уширяется и охватывает более глубокие слои ПК.



Рис. 2. Расчетное распределение поглощенной дозы D(R) по глубине (число частиц 10³)

Результаты расчетов показали, что в достаточно широком энергетическом спектре 71-88% частиц приходится на поглощение в материале, причем с возрастанием энергии электронов эффект отражения уменьшается. Для электронов с $E_e>3$ МэВ глубина концентрации максимальной дозы заметно увеличивается. При $E_e=1$ МэВ коэффициент отражения по энергии выше, чем по частицам, а для больших энергий это соотношение меняется в обратную сторону.

Зависимость средней энергии тормозного рентгеновского излучения от энергии падающих электронов носит параболический характер. Имеющиеся отклонения от линейности можно отнести к изменению углового распределения тормозного излучения, т.е. направленности излучения фотонов по направлению движения падающих электронов с увеличением их энергии. В исследованной модели детектор регистрировал только фотоны, вышедшие за образец с необлучаемой стороны.

С ростом энергии падающих электронов растет интенсивность тормозного излучения. Энергия максимальной интенсивности изменяется незначительно, и это изменение в приближении имеет линейную зависимость. Характер кривых при различных энергиях электронов сохраняется.

Моделирование процессов прохождения протонов в полимерном композите. В конце пробега протонов имеется ярко выраженное увеличение поглощенной дозы (рис. 3), причем величина пробега не превышает 350 мкм для энергии падающих частиц E_p=5 МэВ. Для E_p>3 МэВ происходит увеличение величины поглощенной дозы в конце пробега с увеличением энергии протонного пучка, а для протонов с E_p=5 МэВ это увеличение носит скачкообразный характер.

Наблюдается страгглинг частиц, и для энергии протонов $E_p=5$ МэВ он составляет ≈ 20 мкм. Из-за малой длины пути протонов с $E_p=1$ МэВ, относительный разброс составляет достаточно большую величину $\approx 30\%$ от среднего пробега, и по мере увеличения энергии падающих частиц эта величина уменьшается.



Рис. 3. Зависимость поглощенной дозы от длины пробега (число частиц 10³)

С ростом энергии пропроисходит тонного пучка коэффициента vвеличение усиления, и при E_p>4 МэВ наблюдается резкое увеличение дозы в конце пробега по отношению к начальному значению. При меньших энергиях частицы по пути своего движения быстрее теряют энергию, а значит ионизация среды при E_p=1 МэВ будет более равномерной, чем для энергии протонов E_p=5 МэВ, для которой происходит усиление дозы в конце пробега в 9 раз.

Моделирование процессов прохождения γ -излучения в полимерном композите. Анализ выполненных расчетов прохождения γ -излучения показал, что с увеличением толщины защитного экрана и энергии излучения энергетический фактор накопления (ЭФН) для ПК (МОВ-60) возрастает (рис. 4а). Всплеск ЭФН при E_{γ} =0,1 МэВ связан с возбуждением К-слоя атомов висмута и дальнейшим переизлучением γ -квантов с E_{γ} =0,091 МэВ.



Рис. 4. ЭФН (а) и ЭКП (б) ПК (МОВ-60) для плоского мононаправленного уисточника, нормально падающего на плоскую защиту

Энергетический коэффициент пропускания (ЭКП) ведет себя аналогично ЭФН, плавно увеличиваясь с возрастанием энергии фотонов в пределах одного значения его ДСП (исключение наблюдается при E_{γ} =0,1 МэВ) (рис. 4б).



Рис. 5. Зависимость энергетического альбедо от энергии для ПК (МОВ-60)

Изменение величины альбедо в ПК (МОВ-60) от энергии первичного излучения носит экстремальный характер, максимальная величина альбедо достигается при $E_{\gamma} = 0,1$ МэВ (рис. 5).

В пятой главе приведены результаты имитационных испытаний воздействия электронного, протонного и γ-излучения различных энергий на разработанный композит ПК (МОВ-60), на основании которых оценена его радиационная стойкость.

Воздействие низкоэнергетических протонов на полимерный композит. В энергетическом интервале 1-5 МэВ расчетная зависимость пробега протонов, полученная при моделировании, имеет практически линейную зависимость, где длина пробега протона в ПК (МОВ-60) прямо пропорциональна его энергии (рис. 6). Однако измеренная глубина проникновения протонов в ПК оказалась меньше расчетной. Наблюдается также некоторое отклонение в характере зависимости пробега от энергии протонов. Очевидно, это связано с электризацией приповерхностных слоёв ПК и высокой ионизацией молекул Ві-наполнителя.



Рис. 6. Зависимость глубины проникновения протонов в ПК (МОВ-60) от энергии: 1 – расчетная; 2 - экспериментальная

В результате ионизационных процессов, обусловленных проникприповерхностные новением в слои ПК низкоэнергетических протонов, происходит образование двух зон: зоны отрицательного заряда, возникающей в результате δвторичной ионизации электронами, и зоны внедрённого положительного заряда, образовавшейся в результате облучения ПК (МОВ-60) протонами с энергией от 1 до 4,2 МэВ и их остановки на глубине от 0,02 до 0,2 мм. Можно предположить, что при постоянстве энергии потока протонов на определенном отрезке времени возникает межзонное динамическое равновесие между положительно заряженной зоной накопления потерявших энергию протонов и зоной накопления вторичных электронов. В результате облучения и установления межзонного динамического равновесия образуется дополнительная зона ионизированных атомов в приповерхностных слоях ПК, в которой протон отталкивается положительным полем ионов. Результатом этого взаимодействия является дополнительное снижение экспериментально полученных значений пробегов протонов по отношению к расчетным в энергетическом интервале 1-4,2 МэВ.

При облучении образцов ПК протонами с энергией 4,2 МэВ при флюенсе $4 \cdot 10^{14}$ см² возникает электрический пробой внедренного положительного заряда на облученную поверхность образца после достижения в зоне заряда напряженности электрического поля, превышающей электрическую прочность ПК (МОВ-60) ~64 кВ/мм.

Микрофотографии поверхности облучённых образцов не обнаруживают характерных следов микротрещин, но в области облучения отчётливо видно единичное выходное отверстие разрядного канала (рис. 7).



Рис.7. Микрофотографии (x500) поверхности образца ПК (МОВ-60), облучённого пучком протонов с энергией 4,2 МэВ и накопленной дозой 2 МГр: а – поверхность необлучённого ПК; б – выходное отверстие разрядного канала; в – область поверхности облучённого ПК (МОВ-60) в районе выходного отверстия разрядного канала.

На стенках разрядного канала присутствуют в малом количестве микротрещины, и наблюдаются оплавленные области. Для хрупких диэлектриков в момент прорастания разрядного канала при облучении протонным пучком свойственно дробление и образование сетки трещин на поверхности канала за счет генерации ударных волн. Отсутствие такой сетки и микротрещин в области выходного отверстия на поверхности ПК объясняется пластичностью полимерной матрицы, что в конечном итоге приведет к малым потерям прочностных показателей ПК (МОВ-60) в случае электрического пробоя.

Воздействие быстрых электронов на полимерный композит. При непрерывном облучении ПК пучком быстрых электронов с E_e= 2 МэВ наблюдался постепенный спад мощности дозы до достижения некоторого минимального значения. За образцом толщиной 0,2 R (R-эффективный пробег электронов) мощность дозы снижается на несколько процентов и практически не изменяется через 100 сек. с начала облучения. Экспериментально подтверждено наибольшее снижение дозы, обусловленное накопленным объемным зарядом при толщине ПК 0,55-0,6 d/R, которое достигает 40% от первоначальной величины. На



изменении мощности дозы за образцом наблюдается минимум (рис. 8), что возможно связано с полупроводниковыми свойствами наполнителя. За счет него происходит перераспределение объемного заряда по объему образца и снижение напряженности поля. В итоге не удается достичь свойственного стеклам снижения до 10% мощности дозы за заряженным образцом [4-5], а высокая концентрация атомов Ві приводит к уменьшению толщины максимального действия объемного заряда на пучок электронов до 0,55-0,60R (для радиаци-

онно-заряженных стекол эта величина составляет 0,8R).

При облучении образцов, толщина которых превышала эффективный пробег электронов (1,5 R), измерялась мощность дозы тормозного излучения. В результате выявлено снижение мощности дозы на 38%. Доза тормозного излучения за образцом ПК снижается из-за уменьшения выхода генерации тормозного излучения в первых слоях диэлектрика, поглотивших электроны и дающих наибольший вклад в поглощенную дозу D. Защитная роль глубинных слоев ПК состоит в подавлении тормозного излучения за счет высокой концентрации атомов висмута (54 %) и плотности ПК (4420 кг/м³).

Локализацию электрических полей можно определить по распределению поля поглощенных доз в плоскости поперечного сечения материала ПК. Полученные экспериментальные результаты согласуются с расчетными. Одинаковая доза достигается на глубине, которая в приближении прямо пропорциональна энергии электронов, а кривые распределения поглощенной дозы имеют экстремальный характер.

По результатам определения УЗ-методом неоднородностей, вызванных наличием механических напряжений от неоднородного распределения объемного заряда, показано более равномерное заряжение образца, чем следует из распределения доз. Данное явление может быть связано с распределением напряженности за счет наличия полупроводникового наполнителя.

Результаты пробоя радиационно-заряженного ПК (МОВ-60) оказывались разными для образцов, заряженных электронами с энергией $E_e=5$ МэВ (флюенс $7\cdot10^{16}$ см⁻²), и образцов, облучённых протонным излучением энергией $E_p=4,2$ МэВ (флюенс $4\cdot10^{14}$ см⁻²). В случае электронного облучения пробой происходил по всему объёму диэлектрика с разрушением образца.



Рис. 9. Микрофотография (x10000) осколка образца ПК (MOB-60), облучённого электронами с энергией E=5 МэВ до разрушения

рядных каналов.

Механизмы формирования разрядных каналов для образцов, облучённых низкоэнергетическими протонами и быстрыми электронами, различаются (рис. 7 и 9). Причина различий в том, что локализация и характер электрических полей внедрённого заряда для протонов и электронов различаются по глубине проникновения и знаку заряда.

Факт пробоя с разрушением образца диэлектрика свидетельствует об относительно равномерном распределении неоднородности электрического поля внедрённого заряда, а также об имеющихся механизмах направленной ориентации прорастания раз-

Применение полупроводникового наполнителя МОВ позволяет изменить механизм накопления объемного заряда и последующего пробоя, отличных от тех, что протекают в чистом диэлектрике, а также композиционных материалах, в которых диэлектриками являются и матрица, и наполнитель. При наличии в материале полупроводниковых областей (МОВ-60) происходит перераспределение полученного и накопленного с облучением заряда, что увеличивает общую электрическую ёмкость образца материала. Процесс развития разрядных каналов при пробое носит частично фрактальный характер, а в основном пробой происходит в направлении наименьшего электрического сопротивления, что определяется расстоянием между точками дефектности и их средним количеством в единице объёма диэлектрика, то есть концентрацией наполнителя.

Для выявления роли полупроводниковых свойств наполнителя проведено сравнение с ПК на основе фторопласта и металлоолигомерного наполнителя полиэтилсиликоната висмута (ПЭСВ).

Время до пробоя при увеличении концентрации наполнителя МОВ в сравнении с ПЭСВ в интервале 40-60% растёт, причём различие при 60% более чем двукратно. Такое отличие обусловлено именно введением в структуру композита полупроводниковых элементов. Введение наполнителя, обладающего полупроводниковыми свойствами, приводит к более равномерному перераспределению объемного заряда и уменьшению электрической неоднородности, что обуславливает увеличение электрической прочности при облучении электронами с увеличением содержания наполнителя в интервале концентраций 40-60%, в отличие от ПК с наполнителем ПЭСВ. Для ПК (МОВ-60) электрическая прочность при облучении электронами составляет 64 кВ/мм.

Защита от поверхностной электризации полимерного композита. С целью создания на поверхности ПК токопроводящего покрытия, способного снимать накопленный поверхностный заряд, выявлена возможность нанесения латунного покрытия методом магнетронного напыления на фторопластовую матрицу. Установлена возможность съема поверхностного электрического заряда, а также высокая степень адгезии покрытия к подложке по отсутствию трещин на поверхности после 10-кратного термоциклирования от +150 °C до - 150 °C.

Радиационно-защитные свойства полимерного композита. Экспериментальное определение защитных характеристик материала ПК (МОВ-60) проведено для условий «барьерной и «узкой геометрии».

Таблица 2

Материал защиты	Плотность, г/см ³	Источник ү-излучения	
		¹³⁷ Cs	⁶⁰ Co
ПК (МОВ-60)	4,42±0,05	2,0±0,1	3,7±0,1

Длины релаксации мощности дозы у-излучения, см

Рассчитанные с помощью моделирования значения коэффициентов ослабления для энергий исследованных у-источников близки к экспериментальным (табл. 3).

Таблица 3

Juoppug KoB	Рассчитанные значения		Экспериментальные значения	
энергия, кэр	μ/ρ, см²/г	μ, см ⁻¹	$\mu_{\text{полн}}/\rho, c M^2/\Gamma$	$\mu_{\text{полн}}, \text{ cm}^{-1}$
661	0,149	0,658	0,136	0,599
1250	0,093	0,412	0,084	0,370

Полные коэффициенты ослабления µполн у-излучения в материале

Отношение функций ослабления мощности дозы для «барьерной» геометрии к аналогичной функции для «узкой» геометрии позволило рассчитать дозовые факторы накопления В_{доз} (r) для E_y = 661 кэВ и E_y=1250 кэВ.

Экспериментально определены функции Вдоз(г, Е), которые имеют вид:

 $B_{I03}(r, 661\kappa_3B) = \exp(0.077r; B_{I03}(r, 1250\kappa_3B)) = \exp(0.109r.$

Критерий радиационной стойкости полимерного композита. Согласно ГОСТ 25645.331 проведена оценка величины арбитражного критерия радиационной стойкости (АКРС) для разработанного полимерного композиционного материала ПК (МОВ-60) по изменению механических и электрических свойств композитов, подвергнутых γ-облучению ⁶⁰Со-источником (E=1,25 МэВ и поглощенной дозой до 5 МГр). Электрическая прочность измерялась при электронном облучении.

Полученные результаты по оценке радиационной стойкости ПК показали, что при поглощенной дозе до 0,5 МГр механическая прочность композита не изменялась, а электрическая прочность оставалась неизменной до поглощенной дозы 0,2 МГр. Величина АКРС для разработанного ПК (МОВ-60) составила 5, что превосходит АКРС для ПК, не прошедшего γ-модифицирование в 50 раз и в 5 раз в сравнении с материалом "Неутростоп C-Pb".

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Разработана технология получения высоконаполненного композита на основе фторопластовой матрицы и модифицированного кремнийорганическим олигомером оксида висмута. Выявлена оптимальная степень наполнения фторопластовой матрицы модифицированным оксидом висмута (МОВ) для умодифицированного ПК (60 мас.%), что на 10 мас.% превосходит результаты, полученные по стандартной технологии, с достижением более высоких физикомеханических показателей ПК.

При γ -облучении (⁶⁰Co) ПК происходит радиационная закалка фторопласта и его химическое взаимодействие с МОВ преимущественно за счет образования парамагнитных центров на атомах кремния Si•-типа в наполнителе и пероксидных CFO₂•-типа макрорадикалов в полимере. В зависимости от поглощенной γ -дозы изменяется характер накопления радикалов, и их соотношение непрерывно изменяется.

2. По результатам моделирования прохождения быстрых электронов и протонов с энергией 1-5 МэВ через ПК рассчитаны коэффициенты поглощения и отражения электронного пучка, коэффициент усиления дозы для протонного пучка.

Выявлены общие закономерности формирования энергетических и числовых констант поглощения, пропускания, накопления и отражения фотонного излучения в рентгеновском и γ -диапазоне (E_{γ} =0,05-1,25 МэВ) в ПК разработанного состава. Рассчитаны массовые и линейные коэффициенты ослабления γ излучения. Системные физические данные по радиационной защите оформлены по международному стандарту, что обеспечивает выполнение специальных инженерных расчетов при проектировании радиационной защиты.

3. Результатом электрического пробоя радиационно-заряженного полимерного композита для образцов, облученных потоками быстрых электронов (E_e=5 MэB), становится образование развитой сети объемных разрядных каналов, а при воздействии протонов (E_p=4,2 MэB) возникает единичный разрядный канал. На характер образования разрядных каналов влияют имеющиеся в структуре полупроводниковые области.

Механизм защиты от электронного облучения за счет формирования в объеме диэлектрика полупроводниковых областей заключается в перераспределении накопленного электрического заряда, что увеличивает общую электрическую ёмкость образца ПК и время до пробоя (в 2-2,5 раза по сравнению с ПК, наполненным металлоолигомерным диэлектриком полиэтилсиликонатом висмута). Пробой преимущественно происходит в направлении наименьшего электрического сопротивления ПК с формированием разрядных каналов, разрядный ток в которых имеет практически равные величины. Показано повышение электрической прочности ПК при облучении его электронами с увеличением содержания наполнителя (от 40 до 60 мас.%) до E_{np} =64 кВ/мм.

 Рассчитанные с помощью моделирования значения кратности ослабления γ-излучения в интервале 0,05-1,25 МэВ практически совпадают с экспериментальными результатами.

ПК (МОВ-60) обладает повышенной радиационной стойкостью, величина арбитражного критерия радиационной стойкости (АКРС) составляет 5, что превосходит АКРС для ПК, не прошедшего γ-модифицирование, в 50 раз и в 5 раз в сравнении с известным материалом "Неутростоп C-Pb".

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акишин А.И. Разрядные и синергические явления в облученных диэлектриках могут дестабилизировать космическое и термоядерное оборудование / А.И. Акишин. – М.: Препринт НИИЯФ МГУ, 1997. – 31 с.

2. Акишин А.И. Космическое материаловедение: методическое и учебное пособие / А.И. Акишин. – М.: НИИЯФ МГУ, 2007. – 209 с.

3. Шилов А.Е. Радиационные условия для высокоорбитальных космических аппаратов в период максимума солнечной активности / А.Е. Шилов, С.Н. Волков, И.П. Безродных, [и др.] // Вопросы электромеханики. – 2010. – Т. 115. – С. 47-52.

4. Цетлин В.В. Снижение мощности дозы электронного излучения за слоями заряжающихся диэлектриков / В.В. Цетлин, Т.К. Павлушкина, В.И. Редько // Атомная Энергия. – 1993. – Т. 74, вып. 2. – С. 163-165.

5. Цетлин В.В. Взаимодействие электронов со стеклообразными диэлектриками применительно к проблеме радиационной защиты космических аппаратов: Автореф. дис. докт. техн. наук. — Москва, 1998. – 49 с.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Павленко В.И. Явления электризации диэлектрического полимерного композита под действием потока высокоэнергетических протонов / В.И. Павленко, А.И. Акишин, Д.Г. Тарасов, [и др.] // Известия Самарского научного центра РАН. – 2010. – Т.12. - №4(3). –С. 677-681.

2. Павленко В.И. Радиационно-защитный металлоолигомерный наполнитель для полимерных композитов/ В.И. Павленко, О.Д. Едаменко, Д.Г. Тарасов, [и др.] //Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2011. - №2. – С. 117-120.

3. **Тарасов** Д.Г. Оценка защитного эффекта и модель распределения быстрых электронов в полимерных радиационно-защитных композитах / Д.Г. Тарасов // Фундаментальные исследования. – 2012. - №6(3). – С. 674-677.

4. Павленко В.И. Воздействие высокоэнергетических пучков быстрых электронов на полимерные радиационно-защитные композиты / В.И. Павленко, Р.Н. Ястребинский, Д.Г. Тарасов, [и др.] // Вопросы атомной науки и техники. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. – 2010. - №1. – С. 129-134.

5. **Тарасов** Д.Г. Синтез нового радиационно-защитного диэлектрического материала на основе высоконаполненного полимерного композита для защиты бортовой аппаратуры КА/ Д.Г. Тарасов // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых специалистов «Актуальные проблемы авиации и космонавтики». – Красноярск, 2010. – С. 125-126.

6. Павленко В.И. Исследование влияния пучков быстрых электронов на структуру и свойства радиационно-защитных композиционных диэлектрических материалов /В.И. Пвленко, Р.Н. Ястребинский, **Д.Г. Тарасов**, [и др.] // Наука и технологии: краткие сообщения XXX Российской школы, посвященной 65-летию Победы. Том 1. – Екатеринбург, 2010. – С. 36-38.

7. Тарасов Д.Г. Влияние концентрации наполнителя с полупроводниковыми свойствами на электрические характеристики полимерного композита /Д.Г. Тарасов //Труды 2-й Всероссийской школы-семинара студентов, аспирантов и молодых ученых по тематическому направлению деятельности национальной нанотехнологической сети «Функциональные наноматериалы для космической техники». – Москва, 2011. – С. 234-237.

8. Павленко В.И. Влияние полупроводникового наполнителя на явления электризации полимерного композита под действием корпускулярных излучений/В.И. Пвленко, Д.Г. Тарасов, Р.Н. Ястребинский, [и др.] // Наука и технологии: материалы XXXI Всероссийской конференции. – Миасс, 2011. – С. 46-48.

9. Тарасов Д.Г. Синтез радиационно-защитного наполнителя на основе модифицированного оксида висмута /Д.Г. Тарасов, П.В. Матюхин, Ю.М. Бондаренко,[и др.] // Материалы III Всероссийской научно-инновационной молодежной конференции «Современные твердофазные технологии: теория, практика и инновационный менеджмент». – Тамбов, 2011. – С. 320-323.

10. Бондаренко Ю.М. Физико-химическая активация поверхности наполнителя радиационно-защитного композита / Ю.М. Бондаренко, П.В. Матюхин, Д.Г. Тарасов // Материалы III Всероссийской научно-инновационной молодежной конференции «Современные твердофазные технологии: теория, практика и инновационный менеджмент». – Тамбов, 2011. – С. 288-291.

11. Павленко В.И. Моделирование воздействия быстрых электронов на полимерные радиационно-защитные композиты / В.И. Павленко, Г.Г. Бондаренко, Д.Г. Тарасов, [и др.] // Труды XXII Международной конференции «Радиационная физика твердого тела». – Москва, 2012. – С. 222-228.

12. Композит для защиты от космической радиации: заявка на пат. №2012148234 Рос. Федерация, дан приоритет 12.11.2012 / Павленко В.И., Тарасов Д.Г., Едаменко О.Д., Ястребинский Р.Н., Черкашина Н.И.; заявитель БГТУ им. В.Г. Шухова.

ТАРАСОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ФТОРОПЛАСТОВОГО КОМПОЗИТА К ИОНИЗИРУЮЩЕМУ ИЗЛУЧЕНИЮ В УСЛОВИЯХ МАГНИТОСФЕРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

01.04.07 - «Физика конденсированного состояния»

Подписано в печать	
Объем 1,0 Усл. п. л.	Заказ №

Формат 60×84 1/16 Тираж 100

Отпечатано в Белгородском государственном технологическом университете им. В. Г. Шухова

Г.

308012, г. Белгород, ул. Костюкова 46